

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
 ФЕДЕРАЦИИ
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
 образования
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
 АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Кафедра № 6

УТВЕРЖАЮ

Руководитель образовательной программы

(подпись, инициалы, фамилия)

К. В. Елифанова

(подпись)

« 26 » _____ июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Метрологическое обеспечение технологических процессов и нанотехнологии»
 (дисциплина делопроизводства)

Код направления подготовки/специальности	27.04.01
Наименование направления подготовки/специальности	Стандартизация и метрология
Наименование направления/специальности	Метрологическое обеспечение инженерно-технических процессов и производства
Форма обучения	очная
Год приема	2024

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)

26.06.24

А. Г. Дубарь
(подпись, фамилия)

Программа одобрена на заседании кафедры № 6
 «26» июня 2024 г., протокол № 14

Заведующий кафедрой № 6

26.06.24

В. В. Овчинникова
(подпись, фамилия)

Заместитель директора института ФТИИТ по методической работе

26.06.24

Ю. А. Новикова
(подпись, фамилия)

Аннотация

Дисциплина «Метрологическое обеспечение технологических процессов в наноиндустрии» входит в образовательную программу высшего образования – программу магистратуры по направлению подготовки/ специальности 27.04.01 «Стандартизация и метрология» направленности «Метрологическое обеспечение интеллектуальных процессов и производств». Дисциплина реализуется кафедрой «№ 6».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

ПК-1 «Способен разрабатывать и внедрять новые методы и средства технического контроля»

ПК-2 «Способен осуществлять научно-техническую деятельность и экспериментальные разработки в области обеспечения единства измерений».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологическими процессами производства различных объектов наноиндустрии. Основная сложность, с которой приходится сталкиваться в процессе изготовления наноматериалов, является необходимость контроля их основных структурных параметров с помощью измерительных приборов. Поэтому в основе выбора технологических процессов получения наноструктурированных материалов лежат методы и методики исследования характеристик и параметров этих нанообъектов. Правильно выбранные методы и методики исследования параметров и характеристик нанообъектов обеспечивают требуемое качество, в то время как даже незначительные отклонения от установленных требований методик исследования может привести к существенным изменениям свойств.

В настоящее время используется определенный комплекс методов исследования микро и наноструктур, среди которых можно выделить основные группы методов: электронная микроскопия высокого разрешения; методы сканирующей электронной микроскопии; сканирующая туннельная микроскопия; рентгенодифракционные методы с использованием эффекта высокой светимости синхротронных источников; методы электронной спектроскопии для химического анализа.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия самостоятельная работа обучающегося.

В программу, на фоне широкого внедрения информационных технологий во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и сфере образования и, в частности, в системе ГУАПа, включены отдельные элементы искусственного интеллекта, которые все больше становятся неотъемлемой частью образовательного процесса, существенно повышающего его качество и эффективность.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Язык обучения по дисциплине «русский».

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

1.2. Целями преподавания дисциплины является получение студентами необходимых знаний в сфере метрологического обеспечения технологических процессов в наноиндустрии, связанных с прикладными исследованиями конструированием и практическим использованием материалов и веществ на атомном и молекулярном уровнях, а также средств, методов и методик исследования физических, физико-химических и геометрических параметров и характеристик твердотельных и молекулярных объектов. При этом ключевое внимание уделено изучению особенностей высокоразрешающих методов исследований молекулярных объектов, обеспечивающих получение наиболее полной информации об основных свойствах и характеристиках и протекающих в них процессах.

1.3. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО).

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

Категория (группа) компетенции	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональные компетенции	ПК-1 Способен разрабатывать и внедрять новые методы и средства технического контроля	ПК-1.3.2 знать виды, принцип действия и классификацию средств измерений, технических устройств с измерительными функциями, средств технического и допускового контроля ПК-1.3.3 знать документы по стандартизации, регламентирующие вопросы единства измерений и метрологического обеспечения производств, контроля качества продукции ПК-1.3.4 знать метод технического контроля качества, принципы нормирования точности ПК-1.У.1 уметь анализировать и определять потребность в разработке новых методов и средствах измерений, контроля и испытаний с целью определения возможности и целесообразности их использования.
Профессиональные компетенции	ПК-2 Способен осуществлять научно-техническую деятельность и экспериментальные разработки в области обеспечения единства измерений	ПК-2.3.1 знать правовые акты и нормативные документы в области единства измерений, методы оценки результатов измерений и оценивания неопределённости измерений

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- физические основы измерений и эталоны;
- методы и средства измерений, испытаний и контроля;
- основы информатизации измерений;
- основы электротехники и радиотехники;
- основы моделирование систем и процессов;
- прикладная и законодательная метрология;
- общая теория измерений.

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин:

3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№ 3
1	2	3
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час)	3/ 108	3/ 108
Из них часов практической подготовки	17	17
Аудиторные занятия, всего час.	34	34
в том числе:		
лекции (Л), (час)	17	17
практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	17	17
Самостоятельная работа, всего (час)	74	74
Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**)	Дифф. Зач.	Дифф. Зач.

Примечание: ** кандидатский экзамен

4. Содержание дисциплины

3.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий.

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
Семестр 3					

Раздел 1. Основные понятия нанотехнологий и информационных технологий. Общие сведения об объектах исследования наноструктур. Назначение, определения, классификация 1.1. Введение в наномир и в информационные технологии, основные положения.	2	2			10
Раздел 2. Структура, свойства, методы получения наноструктур и особенности их применения. Тема 2.1 Физико-химические свойства наноструктур, особенности методов исследования.	4	4			15
Раздел 3. Характеристика методов исследований объектов микро и наноструктур 3.1 Основные гетерогенные процессы формирования наноструктурированных объектов	4	4			12
Раздел 4. Физические принципы построения технических средств исследования наноструктур.	2	2			8
Раздел 5. Основы механики и конструкций средств измерений наноструктурированных объектов Тема 5.1. Технические характеристики приборов, блоков и узлов.	3	3			17
Раздел 6. Безопасность нанотехнологий и проблемы окружающей среды Тема 6.1 . Характеристика наночастиц и виды воздействия наночастиц на окружающую среду	2	2			12
Итого в семестре:	17	17			74
Итого	17	17	0	0	74

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

3.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий.
Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
Раздел 1	Тема 1. Основные понятия нанотехнологий и информационных технологий. Общие сведения об объектах исследования наноструктур. Назначение, определения, классификация Тема 1.1. Введение в наномир и в информационные технологии, основные положения. В настоящее время происходят коренные изменения в сфере высоких технологий, микромеханики и других областях человеческой

деятельности, связанных с фундаментальными и прикладными исследованиями, конструированием и практическим использованием материалов, устройств и средств измерений объектов, элементы которых имеют размеры менее 100 нм. Информация (от лат. «Informatio») - это знания, сведения, сообщения, являющиеся объектом хранения, преобразования, передачи и помогающие решать поставленные задачи.

Информационные технологии (ИТ, от англ. information technology, IT) - широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям управления и обработки данных, в том числе, с применением вычислительной техники. В последнее время под информационными технологиями чаще всего понимают компьютерные технологии. В частности, информационные технологии имеют дело с использованием компьютеров и программного обеспечения для хранения, преобразования, защиты, обработки, передачи и получения информации. Специалистов по компьютерной технике и программированию часто называют ИТ-специалистами.

Тема 1.1. Основные черты современных информационных технологий:

- компьютерная обработка информации по заданным алгоритмам;
- хранение больших объёмов информации на машинных носителях;
- передача информации на любые расстояния в ограниченное время.

Информационная технология формирует передний край научно-технического прогресса, создает информационный фундамент развития науки и всех остальных технологий. Развитие информационных технологий во всем мире объясняется возросшей интенсивностью информационных потоков вследствие развития процессов глобализации мировой экономики и становления информационного пространства. Управленческая деятельность нуждается в информационном обеспечении, так как обработка информации для принятия управленческих решений и выработки управляющих воздействий занимает достаточно много времени. Тема 1.2. Нанотехнологии в информационных технологиях

Человечество во все времена стремилось улучшить условия своего существования. Теперь большинство из нас уже не может представить себе жизнь без современных благ цивилизации, достижений науки, техники, медицины. Следующим шагом в этом развитии станет освоение нанотехнологий, в частности, систем очень малого размера, способных выполнять команды людей. В настоящее время нанотехнологиям уделяется большое внимание - создаются исследовательские институты, развернута подготовка специалистов. В США этими вопросами занимаются такие известные фирмы, как Intel, MEMS Industry Group, Sandia National Labs. Рассматриваемый круг вопросов - от ручки без разбрызгивания чернил до беспроводной передачи данных, оптических устройств управления оружием и миниспутников. Агентство перспективных разработок МО США реализует программу "Умная пыль", направленную на создание сверхминиатюрных устройств, способных генерировать энергию, проводить мониторинг окружающей среды, накапливать и передавать информацию. Очень значимое достижение в области нанотехнологий - создание ядра операционной системы.

Ядром - центральная часть операционной системы (ОС), обеспечивающая приложениям координированный доступ к ресурсам компьютера, таким как процессорное время, память и внешнее аппаратное обеспечение. Также обычно ядро предоставляет сервисы файловой системы и сетевых протоколов. На данное время уже выпущены операционные системы на основе 2, 4 и 6 ядер.

Сегодня уже создан новый теплопроводный интерфейс, призванный защищать микросхемы будущего от перегрева. Ученые решили отказаться от традиционного интерфейса на мазевой основе, содержащей мелкие металлические частицы. Вместо этого они предложили выращивать теплопроводные элементы прямо на поверхности микросхемы.

В результате поверхность чипа покрывалась целым лесом наноскопических углеродных нанотрубочек, которые и представляли

	<p>собой основу нового теплопроводного интерфейса. Для выращивания нанолеса на поверхности полупроводника были нанесен рисунок с использованием специальных шаблонов из молекул с разветвленной цепью, именуемых дендримерами (dendrimers). Затем в точках разветвления рисунка были размещены частицы-катализаторы роста углеродных трубочек, выполненные из переходных металлов: железа, никеля, кобальта или палладия диаметром порядка 10 нм. Обработанные катализаторами полупроводники помещались в камеру с метановой атмосферой, где и происходил собственно процесс "выращивания" углеродных нанотрубок с диаметром, стремящимся к таковому частиц-катализаторов</p> <p>Компания IBM представила новое поколение серверных процессоров Power-7 и семейство серверов на их базе. Процессоры будут поставляться в 4-, 6- и 8-ядерных конфигурациях, причем каждое ядро будет поддерживать 4 информационных потока. Это означает, что восьмиядерный процессор Power-7 сможет одновременно поддерживать до 32 задач. По сравнению с предыдущим поколением процессоров Power-6 число ядер в старшей модели увеличилось в четыре раза.</p>
Раздел 2	<p>Тема 2. . Структура, свойства, методы получения и особенности применения наноструктур.</p> <p>Тема 2.1 Физико-химические свойства наноструктур</p> <p>Идею о том, что возможно создавать нужные нам устройства и другие объекты, собирая их "молекула за молекулой" и, даже, "атом за атомом" обычно возводят к знаменитой лекции одного из крупнейших физиков XX века Ричарда Фейнмана «Там внизу — много места». Эта лекция была прочитана им в 1959 году; большинство современников восприняли её как фантастику или шутку.</p> <p>Современный вид идеи молекулярной нанотехнологии начали приобретать в 80-е годы XX века в результате работ К. Э. Дрекслера, которые также сначала воспринимались как научная фантастика. При этом фундаментальная монография "Наносистемы. Молекулярная техника, производство и вычисления" имеет, несомненно, основополагающее значение. Сам термин нанотехнология стал популярен именно после выхода в свет знаменитой книги Э. Дрекслера "Машины творения" и последовавшей за этим дискуссии. Позже Дрекслер в своих научных работах стал использовать термин молекулярная нанотехнология (МНТ) для различения предлагаемых им решений.</p> <p>Оценки параметров наномеханических устройств и машин - в своих работах Э. Дрекслер и его последователи оценивали параметры в основном механических устройств, которые они могли бы иметь при приближении размера компонент к молекулярному масштабу. Это обусловлено не тем, что они недооценивают важность электрических, оптических и т. д. эффектов, а тем, что механические конструкции гораздо проще и достовернее масштабируются. При этом осознаётся, что электрические и прочие эффекты могут дать значительные дополнительные возможности</p> <p>Тема 1.1. Физико-химические свойства наноструктур</p> <p>В области высоких технологий широко используется классификация дисперсных систем по дисперсности, т.е. по размерам и удельной площади поверхности дисперсной фазы. В первом приближении дисперсные системы подразделяются на грубодисперсные и тонкодисперсные, так называемые коллоидные системы.</p> <p>Углеродные структуры - углерод является наиболее распространенным элементом в природе, он существует в твердой фазе и</p>

	<p>нескольких модификациях с различными физико-химическими свойствами: графит, алмаз, карбин, графен. Важнейшей особенностью углерода является способность образовывать цепочки $-C-C-C-$, которые природа использует для создания биологических полимеров, а человек для производства различных синтетических материалов.</p> <p>В конце прошлого столетия были открыты новые углеродные соединения, среди которых фуллерен, обладающий уникальными свойствами. Фуллерен имеет каркасную структуру, которая состоит из заплаток пяти- и шестиугольной формы. В 1990 г. был разработан метод получения фуллерена.</p> <p>В 1991 г. в продуктах электродугового испарения графита были обнаружены цилиндрические углеродные конструкции, получившие названия «нанотрубки». Нанотрубка представляет собой протяженные цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких сантиметров. По существу такая нанотрубка представляет собой одну молекулу, состоящую из миллиона атомов углерода. В общем случае, УНТ обладают уникальными электрическими, механическими и химическими свойствами.</p>
Раздел 3	<p>Тема 3. Характеристика методов исследований объектов микро и наноструктур.</p> <p>Одними из первых инструментов, которые помогли инициировать идеи нанотехнологий, были так называемые сканирующие зонды. Все типы сканирующих зондов были разработаны в Цюрихе в начале 80-х годов. Сама идея очень проста: если, к примеру, провести пальцем по поверхности, то легко отличить бархат от стали или дерева. В данном эксперименте палец действует как структура измерения силы. Данная идея и положена в основу работы сканирующего микроскопа, одного из распространенных сканирующих зондов. Сканирующий зонд при измерении скользит по поверхности так же, как это делают пальцы. Зонд имеет наноскопический размер (часто всего один атом). При движении он может определять несколько различных свойств, каждое из которых соответствует иному измерению.</p> <p>Атомно-силовой микроскоп</p> <p>В атомно-силовом микроскопе электроника используется для измерения силы вводимой кончиком зонда при его движении вдоль поверхности исследуемого объекта.</p> <p>Тема 3.1. Основные гетерогенные процессы формирования наноструктурированных объектов.</p> <p>Под гетерогенными процессами понимают технологические процессы, происходящие на границе раздела фаз и формирующие гетерогенные системы. Гетерогенная система представляет собой термодинамическую систему, состоящую из различных по физическим и химическим свойствам частей или фаз, которые отделены друг от друга поверхностями раздела. Каждая из фаз при этом гомогенна и ее поведение подчиняется законам термодинамики.</p> <p>3.2. Химические гетерогенные процессы.</p> <p>Многие гетерогенные процессы не связаны с химическими реакциями и основаны только на физико-химических явлениях. Химические гетерогенные процессы включают в качестве этапа химические реакции, которые идут в одной из фаз после перемещения туда реагентов или на поверхности раздела фаз. На гетерогенные равновесия влияют температура, давление, концентрации реагентов и продуктов реакции. Равновесие гетерогенных процессов определяется константой равновесия химических реакций, законом распределения компонентов</p>

	<p>между фазами и правилом фаз. Равновесные концентрации компонентов в соприкасающихся фазах определяются законом распределения вещества, который устанавливает постоянное соотношение между равновесными концентрациями вещества в двух фазах системы при определенной температуре. Гетерогенные процессы</p> <p>Тема 3.3 Свойства гетерогенных процессов</p> <p>Механизм гетерогенных процессов сложнее гомогенных, так как взаимодействию реагентов, находящихся в разных фазах, предшествует их доставка к поверхности раздела фаз и массообмен между фазами. Поэтому скорость гетерогенных некаталитических процессов, как правило, меньше скорости гомогенных процессов. Массообмен между фазами осуществляется с помощью диффузии и характеризуется коэффициентом массообмена где D — коэффициент диффузии, δ - толщина пограничного слоя. Для расчета β, который служит описательной характеристикой и для более сложных механизмов переноса, используют критериальные уравнения. $\beta = D / \delta$ в период протекания гетерогенного процесса.</p>
Раздел 4	<p>Тема 4 Физические принципы построения технических средств исследования наноструктур.</p> <p>Тема 4.1. Современное развитие физики и технологии твердотельных наноструктур, проявляющееся в непрерывном переходе топологии элементов электронной техники от субмикронных к нанометровым размерам, потребовало разработку новых и совершенствование уже существующих средств и методов диагностики, а также создание образцов оборудования для анализа свойств и процессов в наносистемах. Сегодня существует огромное количество типов и видов средств диагностики Для исследования наноструктур, получения наноразмерных систем и новых наноструктурных материалов с заданными свойствами, необходимо по-новому решать задачи исследования наноструктуру Для этого требуется изменение традиционных методов, а также создание и развитие совершенно новых средств и методов, процессов присущих объектам нанометрового масштаба.</p> <p>Тема 4.2. Методы электронной спектроскопии</p> <p>Для химического анализа фотоэлектронной микроскопии, фотолюминесценции, которые в настоящее время активно развиваются с перспективами существенного повышения разрешающей способности используемых средств. Известно, что человек способен разглядеть объекты размером приблизительно 0.1 мм. С точки зрения физиологии глаз это простая оптическая система. В 1873 г. было сформулировано правило оптических систем, согласно которому минимальные размеры различаемых деталей рассматриваемого объекта, не могут быть меньше, чем длина волны света (400 нм). Разрешающая способность оптических микроскопов составляет приблизительно 200 нм. Поэтому возникла необходимость в создании систем с более высокой разрешающей способностью, а следовательно с видеосистемами, используемых меньшие длин волн, что и привело к созданию электронных микроскопов.</p> <p>Тема 4.3 . Средства электронной микроскопии</p> <p>В настоящее время используются определенный комплекс методов диагностики наноструктур, среди них целесообразно выделить наиболее распространенные – все разновидности средств электронной микроскопии высокого разрешения. Это исторически первый прибор и метод реально обеспечивающий визуализацию структуры объектов с атомным разрешением.</p>

	<p>Тема 4.4. Назначение и свойства сканирующий электронный микроскопа Сканирующий электронный микроскопа который вплотную приближается по разрешению к атомному уровню, сохраняя возможность получения информации о физических, химических электрических и др. свойствах исследуемых нанообъектов.</p>
<p>Раздел 5</p>	<p>Тема 10. Основы механики и конструкций средств измерений наноструктурированных объектов</p> <p>Тема 10.1. Технические характеристики приборов, блоков и узлов.</p> <p>Основы механики и конструкций средств измерений наноструктурированных объектов</p> <p>Тема 10.1. Область применения наноструктурированных объектов</p> <p>Размеры нанообъектов находятся в диапазоне от 0,1 до 100 нм. Этот диапазон принято называть наномасштабом. Согласно проекту Технической спецификации ISO/DTS 12805 произведенные нанообъекты разделяют по признаку геометрической формы на три категории: частицы - объекты, имеющие три размера в наномасштабе; волокна - объекты, имеющие два размера в наномасштабе; пластины - объекты, имеющие один размер в наномасштабе.</p> <p>Большинство нанообъектов имеет углеродную основу. Долгие годы считалось, что углерод может образовывать только две аллотропные кристаллические структуры - алмаз и графит. Аллотропия - существование одного и того же химического элемента в несхожих формах. Однако в последние годы были обнаружены еще две аллотропные формы углерода, имеющие большую перспективу использования в нанотехнологиях.</p> <p>Тема 10.2. Свойства острейшего зондового датчика.</p> <p>Одним из объектов нанометрологии является острейший зондовый датчик, используемый в сканирующей зондовой микроскопии для исследования размеров и свойств поверхности нанообъектов. Датчик состоит из полупроводникового кристалла (чипа), гибкой консоли (собственно кантилевера) и твердотельного зонда (иглы). Обычно этот датчик называют кантилевером.</p> <p>Геометрически зонд представляет собой иглу конической или призматической формы с углом при вершине 20 - 25° и высотой около 10 мкм. Наиболее важная характеристика зонда - радиус закругления острия r, значение которого обычно не более 1 - 25 нм. Величина радиуса r влияет на размеры области предельно достижимого разрешения. Сложность изготовления зонда существенно увеличивается с уменьшением радиуса острия.</p> <p>Тема 10.3. Технические характеристики датчика наноперемещений</p> <p>В качестве измерительных преобразователей в нанотехнологии используется датчик наноперемещений, представляющий собой совокупность механического элемента и транзистора. Механическим элементом является брусок (наноэлектромеханическая перемычка) из арсенида галлия, закрепленный с обоих концов. Размеры бруска: длина 3 мкм, ширина 250 нм, толщина 200 нм. Детектор перемещения - одноэлектронный транзистор - расположен на расстоянии 250 нм от бруска. Транзистор электрически соединен с бруском через емкость. Внешнее напряжение, приложенное к бруску, заставляет его вибрировать. При перемещении бруска относительно детектора изменяется ток, протекающий через транзистор.</p> <p>Тема 10.4. Назначение датчика силы и массы</p> <p>В датчике силы и массы в качестве первичного измерительного преобразователя использована однослойная углеродная нанотрубка диаметром 1 - 4 нм, расположенная между двумя золотыми электродами. Размеры канавки, через которую протянута нанотрубка: ширина 500 нм, длина 1,5 мкм. Большая упругость углеродной нанотрубки позволяет ей колебаться в широком</p>

	<p>диапазоне частот (от 3 до 200 МГц). Она может также работать в качестве транзистора, что позволяет определять частоту ее колебаний и смещение относительно положения покоя. Устройство работает в вакууме, поскольку на воздухе большое число молекул будет сталкиваться с нанотрубкой или даже абсорбироваться на ней. В зависимости от воздействия внешней силы на измерительный преобразователь он изменяет свое положение. Достигнутая чувствительность устройства позволяет измерять смещение в 0,5 нм.</p> <p>Тема 10.5. Назначение и сфера применения зондового датчика</p> <p>Зондовый датчик устройство, включающее твердотельный острый зонд, гибкую пружинную консоль - кантилевер (англ. <i>cantilever</i> - консоль) и кристалл (держатель). В литературе это устройство нередко называют просто «кантилевером». Изгиб кантилевера с зондом регистрируется обычно с помощью отраженного лазерного пучка света и фотоприемника. Разрешающая способность сканирующих зондовых микроскопов определяется следующими параметрами кантилевера: радиус закругления острия иглы; высота иглы, аспектное соотношение иглы, характеризуемое углом конуса; у наиболее совершенных кантилеверов аспектное соотношение достигает величины 15:1. Для изготовления кантилеверов используются полупроводниковые пластины (например, КДБ-12: кремний <i>p</i>-типа ориентации {100}). Роль изолирующего слоя выполняет диоксид кремния SiO₂. Консоль кантилевера формируется электрохимическим травлением в подогретом растворе щелочи КОН. В процессе травления заготовка медленно поднимается из раствора щелочи для получения конической (или призматической) формы иглы с острым концом. Промышленностью освоены в серийном производстве десятки видов конструкции кантилеверов. Они выпускаются с одной, двумя, тремя или четырьмя консолями. Консоль может быть в плане прямоугольной или треугольной, длинной или короткой, с покрытием или без покрытия. Радиус закругления иглы зонда - от 1 до 25 нм..</p>
<p>Раздел 6</p>	<p>Тема 6. Безопасность нанотехнологий и проблемы окружающей среды</p> <p>Тема 6.1 . Характеристика наночастиц и виды воздействия наночастиц на окружающую среду</p> <p>Тема 6. Вопросы безопасности применения нанотехнологий и воздействие их на состояние окружающей среды естественно весьма актуальны, представляют интерес для ученых и специалистов, в настоящее время слабо изучены. Имеющийся в настоящее время опыт развития нанотехнологий показал, что они могут представлять опасность для человека и окружающей среды, причем опасность эта часто своевременно не выявляется. Примером тому могут быть изменение уровня радиации по сравнению с природным уровнем, повышенная токсичность подобная применению асбеста или средства ДДТ, или концентрация наночастиц в воздухе, когда нормируется весовая концентрация при определенном фоне.</p> <p>Тема 6.1. Характеристика наночастиц</p> <p>Наноматериалы в окружающей среде, сводка актуальных проблем: источники и стоки наночастиц, свободные и связанные искусственные наночастицы, взаимодействие наночастиц с природными материалами, наночастицы как загрязнители окружающей среды, перенос наночастиц в природных условиях, наночастицы как переносчики загрязнителей.</p> <p>Тема 6.2 Результаты превышения концентрации</p> <p>При значительном повышении концентрации микрочастиц в воздухе наблюдается увеличение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - смертности от неспецифических причин; - приступов астмы и использования противоастматических лекарств; - смертности пациентов, страдающих хроническими заболеваниями легких; - осложнений в течение хронических заболеваний легких; - смертности от сердечно - сосудистых заболеваний и госпитализации по поводу последних.

	<p>Тема 6.3 Методы снижения эффективности воздействия применения наночастиц</p> <p>Основные методы, необходимые для снижения воздействия на экологию: принципы предосторожности, обязательное специальное регламентирование нанотехнологий, охрана здоровья и безопасности населения и рабочих, производящих наноматериалы. Для разработки регламентирующих документов по экологическим проблемам использования нанотехнологий и наноматериалов необходимы систематические исследования по оценке жизненного цикла наноматериалов, включая их разработку, производство, транспортировку, применение изделий, переработку и утилизацию: перед продвижением продукта на рынок необходимо оценить воздействие полного жизненного цикла наноматериалов на окружающую среду, здоровье и безопасность людей.</p> <p>Тема 6.4 Воздействие наночастиц на окружающую среду</p> <p>Нанотехнологии могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на окружающую среду и здоровье населения, поэтому параллельно с созданием новых классов наноматериалов и изучением их свойства происходит формирование государственной политики в сфере нанотехнологий и стратегии их дальнейшего развития в мире в целом и в каждой отдельной стране в отдельности. Опасения относительно токсичности наноматериалов напрямую связаны с их размерами, обуславливающими высокую химическую активность и высокую способность проникновения в организм. Наночастицы настолько малы, что легко транспортируются как в человеческое тело, так и в окружающую среду. Например, некоторые наночастицы (типа меди или серебра) могут быть вредными для водной среды. Исследователи проанализировали пробы, взятые из почв и водоемов Германии и Швеции, обратив особое внимание в первую очередь на гуминовые вещества, состоящие из нанометровых частиц, а также наночастицы оксида железа размером от 1 до 40 нм. Ученые обнаружили, что эти железистые частицы играют для свинца роль своеобразного «такси». По утверждению авторитетного журнала <i>The Economist</i>, каждый человек вдыхает 106 наночастиц в минуту.</p> <p>Тема 6.5. Меры, применяемые в целях снижения негативного воздействия на среду</p> <p>Ряд исследований показывает, что наночастицы, получающиеся при сгорании (combustion-derived nanoparticles, CDNP), имеют способность накапливаться в носовых путях, что может вызвать различные заболевания. Наночастицы проникают в организм через дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт и кожу. Наибольшую опасность представляют наночастицы, проникающие в организм при вдыхании. Несомненно, с наночастицами люди сталкивались задолго до появления нанотехнологии: дым, в том числе табачный, смог и т.д. Силикоз, возникающий вследствие вдыхания угольной пыли, рак легких при контакте с асбестом - давно открытые объекты клетки. Очень важным является дозиметрия наночастиц в живых организмах, что требует специальных прецизионных приборов и специальных методик. Поскольку проявление специфических, в том числе и токсикологических, свойств наночастицами связано с их характерным для них очень высоким соотношением поверхности к объему или массе, то эта величина S/V часто принимается за физическую меру потенциального воздействия на живую систему, конечно, очень важно химическое строение, геометрия частиц, распределение их по размерам.</p>
--	---

3.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Семестр 3					
1	Исследование поверхности методом атомно-силовой микроскопии	Проведение внешнего осмотра и подготовка СЗМ к работе в режиме атомно-силовой микроскопии	2	2	1
2	Исследование поверхности методом атомно-силовой микроскопии	Проведение внешнего осмотра и подготовка СЗМ к работе в режиме атомно-силовой микроскопии	2	2	4
3	Исследование поверхности методом атомно-силовой микроскопии	Проведение внешнего осмотра и подготовка СЗМ к работе, подготовка образца к исследованию	4	2	4
4	Подготовка электронного микроскопа и функциональных блоков (узлов) к работе в основных рабочих режимах	Порядок и последовательность включения и выключения СЗМ мод.Solver PRO-M	3	4	2
5	Организация проведения поверки сканирующих зондовых микроскопов	Порядок и последовательность проведения поверки эл. микроскопа мод. Solver PRO-M	3	4	3
6	Организация проведения калибровки сканирующих зондовых микроскопов	Порядок проведения калибровки эл. микроскопа мод. Solver PRO-M	3	3	4
Всего				17	

3.4. Лабораторные занятия
Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено				
Всего				

3.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы
Учебным планом не предусмотрено

3.6. Самостоятельная работа обучающихся
Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 3, час

1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	20	20
Курсовое проектирование (КП, КР)		
Расчетно-графические задания (РГЗ)		
Выполнение реферата (Р)		
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)		
Домашнее задание (ДЗ)	34	34
Контрольные работы заочников (КРЗ)		
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	6	6
Всего:	74	74

4. Перечень учебно-методического обеспечения

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

5. Перечень печатных и электронных учебных изданий

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8.

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий

Шифр/ URL адрес	Библиографическая ссылка	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
https://www.booktech.ru/books/nanotehnologii	Физические основы микро- и наноэлектроники, Дурнаков А.А., /учебное пособие/, УрФУ, 2020, -252 с.	
https://obuchalka.org/knigi-po-nanotehnologiyam	Физические основы нанотехнологий и наноматериалы, Смирнов В.И. /учебное пособие/, Ульяновск, УлГТУ, 2017, 240 с.	
https://obuchalka.org/knigi-po-nanotehnologiyam	Базовые технологии микро- и наноэлектроники: Воротынцев В.М., Скупов В.Д., -М, , Проспект, 2017, -519 с.	
https://obuchalka.org/knigi-po-nanotehnologiyam	Материалы и методы нанотехнологий, Старостин В.В. /учебное пособие/, -М, Бином, 2016, -431с.	
https://obuchalka.org/knigi-po-nanotehnologiyam	Наноматериалы: учебное пособие/, Д.И. Рыжонков, В.В. Лёвина, Э.Л. Дзидзигури, -М, Бином, 2017, -343 с.	
https://obuchalka.org/knigi-po-nanotehnologiyam	Вычислительные нанотехнологии, Попов А.М., /учебное пособие/, Кно-Рус, 2017, -126 с.	
https://znanium.com/catalog/product/1032129 (дата обращения: 07.09.2021). – Режим доступа: по подписке.	Исаев, С.В. Интеллектуальные системы : учеб. пособие / С.В. Исаев, О.С. Исаева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. - 120 с. - ISBN 978-5-7638-3781-0.	

https://znanium.com/catalog/product/1060845 (дата обращения: 07.09.2021). – Режим доступа: по подписке.	Одинцов, Б. Е. Модели и проблемы интеллектуальных систем : монография / Б.Е. Одинцов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 219 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1060845. - ISBN 978-5-16-015839-6.	
--	---	--

6. Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

URL адрес	Наименование
http://science.guap.ru	Научная и инновационная деятельность ГУАП
http://www.consultant.ru	Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
http://www.garant.ru	Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»
http://list-of-lit.ru/nano/notechnologii	Список литературы по нанотехнологии

7. Перечень информационных технологий

7.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10– Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
	Не предусмотрено

7.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
	Не предусмотрено

8. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитории (при необходимости)
1.	Мультимедийная лекционная аудитория	52-51
2.	Специализированная лаборатория «Лаборатория исследования наноматериалов».	Территория ФБУ «Тест - С.-Петербург»

9. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

9.1. Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Дифференцированный зачёт	Список вопросов; Тесты; Задачи.

9.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 – Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции 5-балльная шкала	Характеристика сформированных компетенций
«отлично» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; – уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; – опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления; – умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; – делает выводы и обобщения; – свободно владеет системой специализированных понятий.
«хорошо» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; – не допускает существенных неточностей; – увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; – аргументирует научные положения; – делает выводы и обобщения; – владеет системой специализированных понятий.
«удовлетворительно» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы; – допускает несущественные ошибки и неточности; – испытывает затруднения в практическом применении знаний направления; – слабо аргументирует научные положения; – затрудняется в формулировании выводов и обобщений; – частично владеет системой специализированных понятий.
«неудовлетворительно» «не зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся не усвоил значительной части программного материала; – допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении; – испытывает трудности в практическом применении знаний; – не может аргументировать научные положения; – не формулирует выводов и обобщений.

9.3.

Типовые контрольные задания или иные материалы.

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена	Код индикатора
	Учебным планом не предусмотрено	

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета	Код индикатора
1	Основные идеи и понятия нанотехнологий данные в работах Н. Танигучи.	ПК-5.3.1
2	В какой области промышленного производства впервые стали реализовывать идеи нанотехнологий	ПК-5.У.1
3	Идея лекции Э. Шредингера «Что такое жизнь с точки зрения физики»?	ПК-6.3.1
4	Основные положения лекции, прочитанной Р. Фейнманом в 1959 г.	ПК-8.3.1
5	Основные понятия и определения в области нанотехнологий	ПК-8.3.1
6	Чем наноструктурированные материалы отличаются от классических материалов?	ПК-8.У.1
7	Основные особенности наноразмерных величин, их количественное значение.	ПК-2.3.1
8	Единицы измерения и наименования в области нанотехнологий	ПК-5.3.1
9	Линейные размеры особей животного мира и искусственных объектов в сравнительных значениях нанотехнологий	ПК-5.У.1
10	Основные события истории развития нанотехнологий в период с 400 г. до н.э. по 1959 г.	ПК-6.3.1
11	Основные события истории развития нанотехнологий в период с 1959 по н/в.	ПК-8.3.1
12	Разные подходы к научному определению термина «нанотехнология»	ПК-8.У.1
13	О работах Ж.И. Алферова в области нанотехнологий	ПК-2.3.1
14	Основные идеи Э. Дрекслера о роле нанотехнологий в развитии современного общества, изложенные в книге «Машины созидания»	ПК-5.3.1
15	Основные оценки ожидаемых параметров наномеханических устройств.	ПК-5.У.1
16	Характеристика и принцип работы наноустройства в живых организмах (на примере молекулы «АТФ Синтаза»).	ПК-6.3.1
17	Углерод в природе, в чем заключается его особая роль?	ПК-8.3.1
18	Простейшие конструкции приборов и узлов отдельных различных наноустройств	ПК-8.У.1
19	Возможные пути применения приборов и машин МНТ	ПК-2.3.1
20	Принципы самоорганизации, присущие наиболее распространенным объектам нанотехнологий	ПК-5.3.1
21	Принципы самосборки, присущие наиболее распространенным объектам нанотехнологий	ПК-5.У.1
22	Использование самоорганизации в НТ. Основные свойства	ПК-6.3.1

	самоорганизующихся систем	
23	Наноматериалы, наименования, назначение, основные определения, какие объекты к ним относятся?	ПК-8.3.1
24	Основные типы наноматериалов, разделение по признакам измерений и размерности	ПК-8.У.1
25	Основы классификации и типы структур наноматериалов	ПК-2.3.1
26	Основные категории наноматериалов	ПК-5.У.1
27	Особенности свойств наноматериалов, направления их использования	ПК-6.3.1
28	Основные области применения объектов наноструктурных объектов	ПК-8.3.1
29	Краткая характеристика конструкционных, инструментальных и износостойких материалов	ПК-8.У.1
30	Использование наноматериалов в электронной технике Назначение, краткая характеристика электронного микроскопа	ПК-2.3.1
31	Физический смысл свойств ЭМ: увеличение, разрешение, разрешающая способность.	ПК-5.3.1
32	Условия формирования и свойства электронного луча микроскопа	ПК-5.У.1
33	Физический смысл хроматической аберрации	ПК-6.3.1
34	В чем различие характеристик разрешения оптического и электронного микроскопов	ПК-8.3.1
35	Характеристика разрешающей способности ЭМ	ПК-8.У.1
36	Назначение и устройство и свойства источника электронов	ПК-2.3.1
37	Конструктивные особенности системы освещения ЭМ	ПК-5.3.1
38	Устройство системы коррекции астигматизма в ЭМ	ПК-5.У.1
39	Принцип работы и устройство системы изображения ЭМ	ПК-6.3.1
40	. Блок-схема и принцип работы микроскопа БСОМ	ПК-8.3.1
41	Блок-схема и принцип действия Оже-спектрометра	ПК-5.3.1
42	Фотоэлектронная рентгеновская спектроскопия, блок-схема, принцип действия	ПК-5.У.1
43	Фотоэлектронная рентгеновская спектроскопия, блок-схема, принцип действия	ПК-6.3.1
44	Принцип работы рамановской спектроскопии, блок-схемы процесса измерений.	ПК-8.3.1
45	Назначение принцип действия фотолюминесцентной спектроскопии	ПК-8.У.1
46	Информационные технологии в измерительных системах	УК-2.В.2 ПК-5.В.1
47	Информационные технологии в нанотехнологиях	УК-2.В.2 ПК-5.В.1
48	Принципы и основные элементы искусственного интеллекта	УК-1, В.2, УК-2,3,2
47	Физические принципы действия методов и средств масс-спектрометрии	ПК-5.У.1
48	Физическая сущность туннельного эффекта в радиоэлектронике	ПК-6.3.1
49	Основные свойства объектов молекулярного уровня. Свойства	ПК-8.3.1

	«химического» метода при проектировании молекулярных приборов.	
--	--	--

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

№ п/п	Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы
	Учебным планом не предусмотрено

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов	Код индикатора
1.	Развитие сферы нанотехнологий в стране и за рубежом. Начало вопроса: В какой период времени человечество стало применять продукты нанотехнологий: - в период до нашей эры; - во II веке н/э; - в XVIII в.; - в XIX веке.	ПК-1.3.2
2..	. Начало вопроса: Что послужило приоритетом в развитии нанотехнологий: - создание периодической таблицы химических элементов; - открытие квантовой механики,; - открытие атомной модели строения вещества; экспериментальное подтверждение идеи атомно-молекулярной теории	ПК-1.3.3
3.	.Начало вопроса: назовите размерность нанометрового диапазона: - 10^{-3} м; - 10^{-5} м; - 10^{-6} м; - 10^{-10} м; - 10^{-7} м; - 10^{-9} м	ПК-1.3.4
4.	. Начало вопроса: Величина 1 нм (для наглядности) во сколько раз меньше толщины человеческого волоса: - в 1000 раз; - в 10 тыс. раз; - в 100 тыс. раз; - в 200 тыс. раз	ПК-1.3.3 ПК-1.3.3
5.	Начало вопроса: Что такое «нано». Место наноразмерных объектов в окружающей среде, какие наноразмерные объекты попадают в нанодиапазон и примерная их размерность (для сравнения): - размерность биоклетки; - толщина человеческого волоса; - кишечная палочка; - мин. Размер элемента БИС; - размерность вируса; - диаметр атома водорода.	ПК-2.3.1
6.	Кого из известных ученых можно считать основоположником развития нанотехнологий как науки Начало вопроса: - Э. Шредингер; - Ф.Картер; - Н. Танигучи; - Э. Дрекслер; - Р. Фейнман; - Ж. Алферов	ПК-1.3.2

7.	<p>Исследование микро- и наноструктур. .</p> <p>Начало вопроса: Какие методы диагностики наиболее распространены для исследования физических параметров и характеристик нанообъектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - электронная микроскопия высокого разрешения; - отражательная электронная микроскопия; - микроскопия медленных электронов.; - оптическая микроскопия 	ПК-1.3.3
8.	<p>Важнейшие технологические достижения во второй половине двадцатого столетия.</p> <p>Начало вопроса: Что способствовало, в наибольшей степени, интенсивному развитию нанотехнологий в стране и за рубежом?</p> <p>Начало вопроса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технология создания электровакуумных приборов; - создание микромодульных элементов; - создание интегральных печатных плат; - создание полупроводниковых элементов электронной техники. 	ПК-1.3.3
9.	<p>Физическая сущность закона Гордона Мура.</p> <p>Начало вопроса: В чем заключается смысл эмпирического закона Мура?</p> <ul style="list-style-type: none"> - объяснят принцип получения черно-белого изображения кадра телевизора; - закон объясняет принцип функционирования оптоволоконного элемента; - предельные границы быстродействия компьютера; - предельное число размещения транзисторов на печатной плате компьютера. 	ПК-2.3.1
10.	<p>Средства измерения для исследования наноструктур.</p> <p>Начало вопроса: В чем заключается основные достоинства электронного микроскопа?</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшены весовые и габаритные характеристики приборов, - возможность цифрового представления результатов анализа; - более совершенная, по сравнению с оптическим микроскопом, система получения изображения наблюдаемого объекта; - возможность получения более разнообразной информации об объекте; - пределы увеличения исследуемого объекта. 	ПК-2.3.1
11.	<p>. Основные параметры и характеристики микроскопов.</p> <p>Начало вопроса: Назовите предельные значения характеристики увеличения оптического микроскопа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 раз; - 200 раз; - 400 раз; - 700 раз; - 1000 раз; - 1500 раз 	ПК-1.3.3
12.	<p>Основные параметры и характеристики микроскопов.</p> <p>Начало вопроса: Предельные значения увеличения электронного микроскопа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1000 раз; - 2000 раз; - 5000 раз; - 8000 раз; - 1млн. раз; - 2 млн. раз 	ПК-1.3.3
13.	<p>Основные параметры и характеристики микроскопов.</p> <p>Начало вопроса: Чем определяется разрешающая способность оптического микроскопа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уровнем освещенности рабочей линзы; - величиной фокусного расстояния; - совершенством отклоняющей системы; - длиной волны света. 	ПК-1.3.3
14.	<p>Основные параметры и характеристики микроскопов.</p> <p>Начало вопроса: Чем определяется разрешающая способность электронного микроскопа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - конструкцией системы изображения микроскопа; 	ПК-2.3.1

	<ul style="list-style-type: none"> - устройством электронной пушки, - системой считывания результатов обработки измерений; - расстоянием пролета электрона; - скоростью пролета электрона. 	
15.	<p>Преимущества электронного микроскопа.</p> <p>Начало вопроса: Чем объясняется высокая разрешающая способность электронного микроскопа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - геометрическими размерами рабочей зоны; - использованием электронного потока вместо светового потока; - длиной волны электрона 	ПК-1.3.3
16.	<p>Основные параметры и характеристики электронных микроскопов.</p> <p>Начало вопроса: От чего зависит величина волны электронного потока в микроскопе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - габариты рабочей зоны; - величиной напряжения на аноде; - конструкцией системы изображения микроскопа; - архитектуры отклоняющей системы микроскопа 	ПК-2.3.1
17.	<p>Какая серия стандартов в настоящее время является основной для стандартов из области ИТ?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. серия 25000; b. серия 9000; c. серия 14000; d. серия 16000. 	ПК-6.3.1
18.	<p>Выделите два основных стандарта в области ИТ.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 12207:1995; b. 19760:2003; c. 16326:1999; d. 90003:2004; e. 15288:2002. 	ПК-2.3.1
19.	<p>Назовите аббревиатуру международного союза электросвязи:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. IEEE; b. IEC; c. ITU; d. ISO. 	ПК-2.3.1
20.	<p>Укажите аббревиатуру, обозначающую термин «Всеобщий менеджмент качества».</p> <ul style="list-style-type: none"> a. TQC; b. MBQ; c. UQM; 	ПК-2.3.1

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№ п/п	Перечень контрольных работ
	Не предусмотрено

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(Ниже приводятся рекомендации по составлению данного раздела)

10.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала (*если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине*).

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

Структура предоставления лекционного материала:

- Лекционный материал согласно соответствующих разделов настоящей Программы.

Учебное пособие по освоению лекционного материала имеется в изданном виде:

- Сканирующая микроскопия: /Учебное пособие/ Т.П. Мишура, А.Г. Грабарь, - СПб.; ГУАП, 2016, - 107 с.
- Наноматериалы и технологии: / Учебное пособие/ Т.П. Мишура, А.Г. Грабарь, - СПб.; ГУАП, 2015, - 107 с.
- Методы и средства, применяемые в нанодиагностике: /Учебно-методическое пособие/ А.Г. Грабарь, Н.Н. Скориантов, Р.Н. Целмс, - СПб., ГУАП, 2023, - 102 с.

Если методические указания по освоению лекционного материала имеются в изданном виде, в виде электронных ресурсов библиотеки ГУАП, системы LMS, кафедры и т.д., необходимо дать на них ссылку или привести URL адрес.

Материалы для освоения имеются в электронном виде

Курс в системе LMS <https://lms.guap.ru/new/course/view.php?id=263>

10.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах (*если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине*)

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности.

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными публикациями по теме семинара.

Требования к проведению семинаров

Обязательно для заполнения преподавателем

10.3. Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий *(если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине)*

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Требования к проведению практических занятий

10.4.

10.5. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных работ *(если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине)*

В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен углубить и закрепить знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой эксперимента в соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. Выполнение лабораторных работ состоит из экспериментально-практической, расчетно-аналитической частей и контрольных мероприятий.

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью изучения дисциплины, определяемой учебным планом, и относится к средствам, обеспечивающим решение следующих основных задач обучающегося:

- приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, изучаемых в рамках данной дисциплины;
- закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на лекциях;

- получение новой информации по изучаемой дисциплине;
- приобретение навыков самостоятельной работы с лабораторным оборудованием и приборами.

Задание и требования к проведению лабораторных работ

Обязательно для заполнения преподавателем

Структура и форма отчета о лабораторной работе

Обязательно для заполнения преподавателем

Требования к оформлению отчета о лабораторной работе

Обязательно для заполнения преподавателем

10.6. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового проектирования/выполнения курсовой работы (*если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине*)

Курсовой проект/ работа проводится с целью формирования у обучающихся опыта комплексного решения конкретных задач профессиональной деятельности.

Курсовой проект/ работа позволяет обучающемуся:

Структура пояснительной записки курсового проекта/ работы

Обязательно для заполнения преподавателем

Требования к оформлению пояснительной записки курсового проекта/ работы

Обязательно для заполнения преподавателем

10.7. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может включать в себя контрольную работу.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся являются:

- учебно-методический материал по дисциплине;
- методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по заочной форме обучения).

Если методические указания по прохождению самостоятельной работы имеются в изданном виде, в виде электронных ресурсов библиотеки ГУАП, системы LMS, кафедры и т.д., необходимо дать на них ссылку или привести URL адрес.

10.8. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.

Обязательно для заполнения преподавателем: указываются требования и методы проведения текущего контроля успеваемости, а также как результаты текущего контроля успеваемости будут учитываться при проведении промежуточной аттестации.

10.9. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

– экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

– зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или «не зачтено».

– дифференцированный зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся при изучении дисциплины, при выполнении курсовых проектов, курсовых работ, научно-исследовательских работ и прохождении практик с аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой